
NL-Petten: Furnizarea și întreținerea unui microscop electronic cu scanare cu emisie prin efect de câmp — cu fascicul de ion axat pe plasmă cu fascicul dublu (pFIB — SEM)

I.D.: 36423417

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Data publicarii | 07.06.19 | Coduri CPV | 38512100 38510000 |
|-----------------|----------|------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 08.07.19 16:00 |
|----------------------------------|----------------|

| | |
|------------|--------------------------------|
| Descriere: | Microscopae ionice Microscopae |
|------------|--------------------------------|
